



## 20-я ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ

3–6 марта 2014 г. в Москве состоялись 20-я Всероссийская научно-техническая конференция «Неразрушающий контроль и техническая диагностика (НКТД)» и выставка «Территория NDT». Такие конференции один раз в три года организует Российское общество НКТД в различных городах Российской Федерации.

На пленарном заседании были заслушаны четыре доклада. Академик РАН *Клюев В. В.* рассказал и продемонстрировал фильм о Научно-исследовательском институте интроскопии (НИИИН), который в этом году отмечает 50-летие. НИИИН – первый советский институт, созданный для развития методов и средств неразрушающего контроля. Академик РАН *Клюев В. В.* с 1970 г. возглавляет этот уникальный творческий коллектив, вошедший в первый ряд фирм мира, работающих в области НКТД.

Академик РАН *Горкунов Э. С.*, директор Института машиноведения Уральского отделения РАН, сообщил об исследованиях различных состояний остаточной намагниченности и их устойчивости к внешним воздействиям.

Профессор *Вавилов В. П.* из Института неразрушающего контроля Томского политехнического университета проанализировал развитие теплового контроля композиционных материалов в авиакосмической промышленности и перспективы его практического применения.

Доклад известного итальянского ученого *Джузеппе Нардони* был посвящен пятой годовщине международной Академии неразрушающего контроля, инициатором создания которой он был. На сегодня членами Академии являются 126 ученых мира. Почетным членом Академии избран *Патон Б. Е.*, а членами Академии от Украины – *Троцкий В. А.*, *Казакевич М. Л.* и *Учанин В. Н.*

Более 180 докладов было представлено в работе 12-ти секций конференции: магнитные методы НКТД; электромагнитные методы НКТД; акустические методы НКТД; радиационные методы НКТД; оптические, тепловые, микроволновые методы НКТД; течеискание и капиллярные методы НКТД; методы НКТД остаточного ресурса; Вибродиагностика; акустическая эмиссия; антитеррористическая диагностика; сертификация персонала, стандартизация и метрология в НКТД; Academia NDT International.

На стендовой сессии конференции было представлено 35 докладов.

Доклады конференции продемонстрировали высокий уровень исследований и разработок в области неразрушающего контроля. С программой конференции, сборниками тезисов и докладов можно ознакомиться в офисе УО НКТД.

Доклады конференции продемонстрировали высокий уровень исследований и разработок в области неразрушающего контроля.

Одновременно с конференцией прошла выставка средств и технологий НКТД – «Территория NDT», в которой участвовало более 100 экспонентов, среди которых крупнейшие российские фирмы, производящие средства НКТД: МНПО «Спектр» (г. Москва); НИИИН (г. Москва) и др.

Интересные стенды представили крупнейшие международные фирмы, имеющие свои представительства в Москве: AGFA, Fujifilm, GE Measurement & Control, GE Sensing & Inspection Technologies, Starmans electronics, YXLON International GmbH, Olympus, Sonatest, Socomate, TesTex, NEC, Helling, Technatom, Karl Deotsch.

Следует отметить, что на двух стендах была представлена продукция украинских фирм. Стенд ООО «Промприбор» (г. Москва) представлял средства НК, разработанные и изготовленные в Киеве ООО «Ультракон-Сервис», ООО «Промприлад» и УкрНИИНК. Это отечественные ультразвуковые, магнитные и вихретоковые дефектоскопы, автоматизированные установки для контроля конкретных объектов и многое другое.

Стенд ООО «Специальные Научные Разработки» демонстрировал ультразвуковые толщиномеры с магнитоакустическими преобразователями, коэрцитиметры и другие приборы.

Отдельную группу стендов занимали национальные общества НК, и в частности Украинское общество НКТД. На стенде общества была представлена информация по основным методам контроля качества и разработках ряда предприятий и организаций Украины (ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины, ООО «Дисит» и др.).

В работе конференции и выставки участвовали многие специалисты из Украины: *Мозговой А. В.*, *Луценко Т. М.*, *Безлюдько Г. Я.*, *Галаненко Д. В.*, *Годлевский В. С.*, *Дружинин В. И.*, *Павлий И. В.*, *Павлий А. В.*, *Звягин В. А.* и др.

*Посыпайко Ю.Н.,  
ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины*